

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Matematikai statisztika

ÖSSZEFOGLALÓ

 $K\acute{e}sz\acute{i}tette$ Papp Dorottya

Tartalomjegyzék

1.	Alapfogalmak			
	1.1.	Alapmodell	4	
	1.2.	Fontos eloszlások	4	
2.	Stat	cisztikai becslések	ļ	
	2.1.	Maximum likelihood becslés	(
	2.2.	A momentumok módszere	(
	2.3.	Intervallumbecslések	7	
3.	Hipotéziselmélet			
	3.1.	Paraméteres próbák	8	
	3.2.	Nemparaméteres próbák	8	

1. fejezet

Alapfogalmak

A sokaság, vagy populáció, a vizsgálat tárgyát képező nagyszámú, de véges elemszámú egyedek halmaza. A statisztika, mint tudomány célja a halmaz egészének kevés adattal történő tömör jellemzése és az egyedek leírására a bevezetett változók közötti kapcsolatok leírása. Nincs lehetőség (erőforrás), hogy a populáció minden egyes eleméről adatokat szerezzünk be. Példa sokaságok: ország állampolgárai, gyártott termékek. A statisztikai elemzés tárgya lehet egy véletlen kísérlet is, ami időben változatlan körülmények között elvileg akárhányszor lejátszódhat, pl. terméshozam, lottóhúzás, véletlen egyed kiválasztása.

A statisztikai minta realizáltja a populáció egy kis elemszámú részhalmazára vonatkozó megfigyelések adatai. Például: hőmérséklet adatok, felmérésbe bevont nézők. A mintának reprezentatívnak kell lennie, vagyis tükröznie kell a populáció tulajdonságait. A populáció minden egyedének ugyanakkora esélyt kell biztosítani a mintába kerüléshez, a minta elemszámának pedig elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a következtetések átvihetők legyenek a populációra is. A mintavételezésnek 3 nagy kategóriája:

- Rétegzett mintavételezés: populációt adott szempontok szerint csoportokba osztjuk és a csoportok arányait a mintában is megtartjuk
- Véletlen mintavételezés: mintába kerülő egyedeket sorsolással választjuk ki
- Cenzus: népszámlálás

A mintát egy adatmátrixba írhatjuk fel, aminek n sora és p oszlopa van. Minden sor megfelel a minta egy elemének, minden oszlop pedig egy változónak, a populáció egy mérhető jellemzőjének.

A statisztika a minta realizáció adataiból adott képlettel számolt adat. Pl. átlag, medián, gyakoriság, stb.

1.1. Alapmodell

A matematikai statisztika alapmodellje 4 elemből áll:

- \mathcal{K} , a véletlen kísérlet,
- \bullet Ω , a lehetséges kimenetelek halmaza,
- A, a megfigyelhető események halmaza, és

• \mathscr{P} , a lehetséges valószínűségi mértékek halmaza.

Az elemzés célja, hogy \mathscr{P} -ből kiválasszuk a tényleges valószínűséget, de legalább is egy jó helyettesítő egyedet.

A matematikai alapmodellben a változó $X:\Omega\to\mathbb{R}$ egy valószínűségi változó, melynek minden $\mathbf{P}\in\mathscr{P}$ esetén megadható az eloszlásfüggvénye: $F_x(t)=\mathbf{P}(X< t)$. Ekkor a feladat a következő halmazból kiválasztani a vlóságot legjobban leíró eloszlásfüggvényt:

$$\mathscr{F} = \{ F_x(t) : F_x(t) = \mathbf{P}(X < t) : \forall \mathbf{P} \in \mathscr{F} \}$$

A statisztikai minta ez alapján az X valószínűségi változóval azonos eloszlású, egymással teljesen független $X_1, X_2, ... X_n$ valószínűségi változók együttese. Egy mintavételkor tulajdonképpem megfigyeljük a $\mathscr K$ véletlen kísérletet, aza megállapíTjük, hogy melyik $\omega \in \Omega$ kimenetel realizálódott. Az $X_1(\omega) = x_1, ..., X_n(\omega) = x_n$ szám n-est nevezzük a minta realizációjának.

A statisztika egy valószínűségi változó, aminek eloszlásfüggvényét a minta eloszlásfüggvényéből lehet kiszámolni: $T_n = t_n(X_1, X_2, ..., X_n)$. A statisztika számolt értéke az, amikor $t_n()$ argumentumába a mintarealizáció értékeit helyettesítjük.

Adatcentrum statisztikái:

• átlag:
$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

• medián:
$$m_n = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & \text{ha } n \text{ páratlan} \\ \frac{x_{\frac{n}{2}}^* + x_{\frac{n+1}{2}}^*}{2} & \text{ha } n \text{ páros} \end{cases}$$

• módusz: leggyakrabban előforduló érték a mintában

•

Szóródást jellemző statisztikák:

- standard szórás: $s_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i \bar{x})^2}$, ahol \bar{x} az átlag
- szórás torzítatlan becsléssel: $s_n^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i \bar{x})^2}$
- variáció: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i \bar{x})^2$
- $\bullet\,$ terjedelem: $x_n^*-x_1^*$ (legkisebb és legnagyobb elem közötti különbség)

Eloszlást jellemző statisztikák:

- ferdeség: $s = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i \bar{x})^3}{\left(\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i \bar{x})^2}\right)^3}$, ha s > 0, akkor jobbra ferdül, ha s < 0, akkor balra ferdül
- lapultság: $k = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i \bar{x})^4}{\left(\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i \bar{x})^2}\right)^4} 3$, ha k > 0, akkor csúcsos, ha k < 0, akkor lapos.

A mintaelemeket szokás rendezni is: $X_k^* = ord_k(X_1, X_2, ..., X_n), k = 1, 2, ..., n^1$. Ezeket rendezett mintaelem-statisztikáknak hívjuk. A minta eloszlásfüggvénye és a rendezett minta eloszlásfüggvénye között az alábbi összefüggés áll fenn:

$$F_k(x) = \mathbf{P}(X_k^* < x) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} [F(x)]^i [1 - F(x)]^{n-i}$$

 $F_k(x) = \mathbf{P}(X_k^* < x) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} [F(x)]^i [1 - F(x)]^{n-i}$ A rendezett mintaelem-statisztikák közül különlegesen fontos az empirikus eloszlásfüggvény:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x \le X_1^* \\ \frac{k}{n} & \text{ha } X_k^* < x \le X_{k+1}^* \\ 1 & \text{ha } x > X_n^* \end{cases}$$
 Fontosságát a matematikai statisztika alaptétele adja:

 $\mathbf{P}\Big(\lim_{n\to\inf}\sup_{x\in\mathbb{R}}|F_n(x)-F(x)|=0\Big)=1$, vagyis az empirikus eloszlásfüggvény 1 valószínűséggel, egyenletesen konvergál az elolszlásfüggvényhez.

1.2. Fontos eloszlások

- χ^2 eloszlás
- Student-eloszlás
- F-eloszlás

 $^{^{1}}ord()$ kiválasztja a k-dik legnagyobb elemet az argumentumok közül

2. fejezet

Statisztikai becslések

Előfordul, hogy a minta eloszlásfüggvénye egy képlet, amelyet a ϑ paraméter konkretizál. Ha ismerjük az értékét, meg tudjuk pontosan adni az eloszlásfüggvényt:

$$\mathscr{F} = \{F_x(t,\vartheta) : \vartheta \in \Theta\}$$

Egy adott statisztikai minta segítségével a ϑ paraméter megbecslése a célunk. A paraméter becsléséhez valamilyen alkalmas T_n statisztikát használunk, egy ismeretlen számot egy valószínűségi változóval becsülünk. Ekkor persze felvetődik a kérdés: mikor jó egy ilyen becslés?

- Torzítatlanság: $\mathbf{E}T_n = \vartheta$, vagyis a becslő statisztika pont a becsülendő paraméterérték körül fogja felvenni az értékeit. Indok: egy valószínűségi változó az összes szám körül épp a várható érték körül ingadozik a legkisebb mértékben
 - Aszimptotikus torzítatlanság: a torzítatlansági feltétel csak $n \to \infty$ esetében igaz: $\lim_{n\to\infty} \mathbf{E} T_n = \vartheta$
 - A Cramer-Rao egyenlőtlenség elvi alsó korlátot ad a torzítatlan becslések szórásnégyzeteire. Ha egy statisztikára belátjuk, hogy a szórásnégyzete éppen az alsó korláttal egyenlő, akkor az biztosan hatásos (amiből egyetlen egy van)
- Konzisztencia: $\forall \epsilon > 0$ szám esetén teljesül, hogy $\lim_{n\to\infty} \mathbf{P}(|T_n \vartheta| < \epsilon) = 0$, vagyis garancia van arra, hogy a minta elemszám növekedtével növekszik a becslés pontosságának valószínűsége
 - Erős konzisztencia: $\mathbf{E}T_n = \vartheta$ és $\lim_{n\to\infty} \mathbf{D}^2 T_n = 0$, vagyis azok a torzítatlan becslések, ahol az elemszám növekedtével a szórásnégyzet (variancia) 0-hoz tart. Az erősen konzisztenc statisztikai becslések egyben konzisztensek is
- Hatásosság: két torzítatlan becslés közül a kisebb varianciájú a jobb, hiszen kisebb mértékben ingadozik a paraméter körül, vagyis kevesebb megfigyeléssel is jó becslés kapható. Egy torzítatlan becslés akkor lesz hatásos, ha varianciája minden más torzítatlan becslés varianciájánál kisebb. Hatásos becslésből egyetlen egy létezik csak, ezt érdemes megkeresni egy adott paraméter-becslési problémához
- Elégségesség: egymaga képes helyettesíteni a mintát, a paraméterre vonatkozóan minden információt magába sűrít

- Rao-Blackwell-Kolmogorov tétel: ha létezik hatásos (legjobb torzítatlan)
 becslés, akkor elég azt az elégséges becslés függvényei között keresni
- Ellenőrzini a Neymann-Fisher faktorizációs tétellel lehet

Jó tudni:

- Az átlagstatisztika a várható értéknek, mint paraméternek, a torzítatlan becslése (ha létezik a minta szórása, akkor erősen konzisztens), normális, exponenciális és Poisson esetben hatásos
- A tapasztalati szórásnégyzet a minta varianciájának aszimptotikusan torzítatlan becslése (ha létezik a minta negyedik momentuma, akkor konzisztens is)
- A korrigált empirikus szórásnégyzet statisztik a variancia torzítatlan becslése (ha létezik a minta negyedik momentuma, akkor erősen konzisztens), normális esetben hatásos

2.1. Maximum likelihood becslés

A módszer alapgondolata, hogy ha egy kísérletnél több esemény is bekövetkezhet, akkor legtöbbször a legnagyobb valószínűségű esetményt fogjuk megfigyelni. A mintavételezés során kaptunk egy realizációt, errőr a realizációról pedig az előzőek miatt feltételezzük, hogy azért ezt kaptuk, mert ennek volt a legnagyobb bekövetkezési valószínűségee. Vagyis, az összes lehetséges ϑ paraméter (amitől függ a minta eloszlásfüggvénye) közül vegyük azt, amelynél a kapott realizáció bekövetkezése a maximális. Általános feltételed mellett a becslés konzisztens, aszimptotikusan normális eloszlású és ha van elégséges statisztikai, akkor éppen azt adja meg.

Számítása diszkrét esetben:

 $L(\mathbf{x}, \theta) = P_{\theta}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n) = \sum_{i=1}^n P_{\theta}(X_i = x_i)$, a minta együttes eloszlása. A paraméter maximum likelhood becslése az a $\tau_n(X_1, X_2, ..., X_n)$ statisztika, melyre $L(x, \tau_n(\mathbf{x})) = \max_{\theta} L(\mathbf{x}, \theta)$

Számítása folytonos esetben:

 $L(\mathbf{x}, \vartheta) = P_{\vartheta}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n f_{\vartheta}(x_i)$, a minta együttes eloszlása. A paraméter maximum likelhood becslése az a $\tau_n(X_1, X_2, ..., X_n)$ statisztika, melyre $L(\mathbf{x}, \tau_n(\mathbf{x})) = \max_{\vartheta} L(\mathbf{x}, \vartheta)$

A maximum meghatározásához $L(\mathbf{x}, \vartheta)$ ϑ szerinti első deriváltjának zérushelyeit keressük. A zérushelyek közül az a maximum, ahol a második derivált negatív. Megjegyzés: ha $L(\mathbf{x}, \vartheta)$ deriválása túl nehéz, érdemes a logaritmusát venni (loglikehood függvény, $l(\mathbf{x}, \vartheta)$) és azzal számolni. Mivel a logaritmus függvény szigorúan monoton nő, ezért nem torzítja a zérushelyeket.

Többparaméteres esetben paraméterenként vizsgáljuk az első deriváltakat és a Hesse-mátrix alapján döntünk a maximum helyről. Maximum esetén a mátrix diagonális és az első diagonál elem negatív.

2.2. A momentumok módszere

Legyen adott a valószínűségi mértékek egy tere és az $X_1, X_2, ..., X_n$ statisztikai minta. Tegyük fel, hogy létezik az első k momentum: $m_j = \mathbf{E}_{\vartheta} X_i^j = g_j(\vartheta)$,

vagyis a momentumok a paraméter valamilyen g() függvényeként állnak elő. Tegyük fel, hogy $\exists g_j^{-1}(m_1,m_2,...,m_k)=\vartheta_j$. Tekintsük az $\hat{m}_j=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^j$ empirikus momentum statisztikákat. Ekkor a ϑ_j paraméteres momentumos becslései a $m_j=g_j^{-1}(\hat{m}_1,\hat{m}_2,...,\hat{m}_k)$

2.3. Intervallumbecslések

Eddig az ismeretlen paramétervektort a minta egy függvényével, azaz egyetlen statisztikával próbáltuk meg közelíteni. Konkrét realizációnál tehát, a paramétertér egy pontját egy másik ponttal becsüljük (pontbecslés).

Folytonos eloszlásoknál azonban annak valószínősége, hogy a valószínőségi változó az értékkészletének éppen egy tetszőlegesen kiválasztott pontját fogja felvenni, nulla. Tehát folytonos esetben nulla annak valószínősége, hogy éppen a paramétert találtuk el a becsléssel. Az intervallumbecsléseknél a mintából készített tartományokat definiálunk, amely tartományok nagy valószínőséggel lefedik a kérdéses paraméterpontot.

Legyen adott a valószínésgi mértékeke egy tere és az $X_1, X_2, ..., X_n$ statisztikai minta. Legyen $0 < \epsilon < 1$ rögzített. A ϑ paraméterhez megadhatunk egy legalább $1 - \epsilon$ szignifikanciaszintű konfidencia-intervallumot, ha $t_1(X_1, X_2, ..., X_n)$ és $t_2(X_1, X_2, ..., X_n)$ olyan statisztikák, hogy:

$$\mathbf{P}_{\vartheta}(t_1(X_1, X_2, ..., X_n) \le \vartheta \le t_2(X_1, X_2, ..., X_n)) \ge 1 - \epsilon \text{ mindig igaz.}$$

3. fejezet

Hipotéziselmélet

Adott a \mathcal{K} véletlen kísérlet, az Ω eseménytér, a lehetséges valószínűségek halmaza \mathcal{P} és a felette értelmezett \mathbf{P} Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Tegyük fel, hogy \mathcal{P} két diszjunkt halmazra bontható: \mathcal{P}_0 és \mathcal{P}_1 . Statisztikai próbát akarunk kidolgozni annak eldöntésére, hogy $H_0: \mathbf{P} \in \mathcal{P}_0$ nullhipotézis igaz-e. Ha úgy kell döntenünk, hogy anull hipotézis nem igaz, akkor automatikusan a $H_1: \mathbf{P} \in \mathcal{P}_1$ alternatív hipotézist fogjuk elfogadni. A döntéshez szignifikancia szintet rendelünk, amivel jellemezzük, hogy mennyire erős a döntésünk.

Azonban a döntésünk nem lesz minden esetben helyes, elképzelhető, hogy hibásan döntünk. Elsőfajú hibáról beszélünk, ha H_1 -et fogadjuk el, minközben H_0 igaz. Ennek értékét tudjuk befolyásolni, általában 5-10%-ra választjuk. A hibánk másodfajú, ha H_0 -t fogadjuk el, miközben H_1 az igaz. A másodfajú hiba értékét nehéz megállítani. A kéz hibafajta között trade-offot kell találni, ha az egyiket csökkentjük, a másik nőni fog. A hibavalószínáségeket csak úgy tudjuk csökkenteni, ha növeljük a mintaelemszámot (mivel így csökken a szórás)!

3.1. Paraméteres próbák

Paraméteres próbák esetén feltételezzük, hogy $\mathscr{P} = \{ \mathbf{P}_{\vartheta} : \vartheta \in \Theta \}$, ahol Θ a paramétertér, melyet két diszjunkt halmazra osztunk $(\Theta_0$ és $\Theta_1)$. A nullhiptézisünk ez esetben, hogy $\vartheta \in \Theta_0$, az alternatív hipotézis pedig, hogy $\vartheta \in \Theta_1$.

A pontos döntéshez a minta eloszlásfüggvényét $F_{\vartheta}(x)$ közelítjük a $T_n(X_1, X_2, ..., X_n)$ próbastatisztikával. A szignifikacia szintet ε -nak jelöljük és feltesszük, hogy $\forall \varepsilon \in (0,1): \exists K_1(\varepsilon) < \exists K_2(\varepsilon): \mathbf{P}_{\vartheta}(K_1(\varepsilon) < T_n < K_2(\varepsilon)) \geq 1 - \varepsilon$. Ekkor az elfogadási tartomány: $\mathscr{X}_e = \underline{x} \in \mathscr{R}^n: K_1(\varepsilon) < T_n(\underline{x}) < K_2(\varepsilon)$, ahol \underline{x} a mintarealizáció. Ha $\underline{x} \in \mathscr{X}_e$, akkor a nullhipotézist elfogadjuk az ε szignifikancia szinten.

A tanult paraméteres próbákban közös, hogy **az elemzett minta normális eloszlást követ**. A nullhiptézist a normális eloszlás paramétereivel (várható érték, szórás) fogalmazzuk meg. A próbák adatait a 3.1. táblázat tartalmazza. Mivel képletgyűjtemény használható, a képleteket kihagytam a táblázatból, csak az alkalmazáshoz szükséges információkat gyűjtöttem itt össze.

3.2. Nemparaméteres próbák

Nemparaméteres próbák esetén a statisztikai minta eloszlását nem tekintjük eleve ismertnek. Az előzetes feltevésink nagyon általánosak, pl. folytonos eloszlást követ

3.1. táblázat. Paraméteres próbák

Próba neve	Feltétel	Döntés
egymintás u-	szórás ismert	$ u_{prba} < K_{krit}$
próba		
kétmintás u-	független statisztikai min-	$ u_{prba} < K_{krit}$
próba	ták, szórásaik ismertek	
egymintás t-	szórás nem ismert	$ t_{prba} < K_{krit}$
próba		
független	minták függetlenek, szórá-	$ t_{prba} < K_{krit}$
kétmintás	sai egyenlőeknek tekinten-	
t-próba	dők (→ F-próba)	
összetartozó		$ t_{prba} < K_{krit}$
kétmintás		
t-próba		
Welch-próba	független, normális eloszlá-	$ W_{prba} < K_{krit}$
	sú minták, eltérő szórással	
	(amik nem ismertek)	
F-próba	független, normális eloszlá-	$t \ddot{\text{ort}} \in F_{n-1,m-1}$
	sú minták, szórás nem is-	
	mert	

minta, vagy véges a szórás. Mivel kevesebb feltételt követelünk meg kiinduláskor, nagyonn mintaelemszámra van szükségünk, mint a paraméteres próbák esetén.

Illeszkedés vizsgálat

Illeszkedés vizsgálat esetén azt vizsgáljuk, hogy az elemzett változó eloszlása megegyezike a hipotetikussal. Kapcsoló próbák: χ^2 -próba, egymintás Kolmogorov-Szmirnov próba.

 χ^2 próba (tiszta illeszkedésvizsgálat) esetén a minta értékkészletét fel kell bontanunk r diszjunk intervallumra. Ökölszabály: minden intervallumba kb. ugyanannyi elemnek kell esnie (θ_i)! Minden intervallumra meg tudjuk mondani a bekövetkezés gyakoriságát (p_i). A kritikus érték a χ^2 táblázatból jön.

Egymintás Kolmogoroc-Szmirnov mintánál az empirikus eloszlásfüggvénnyel $F_n(x)$ közelítjük a hipotetikus eloszlás függvényt $F_o(x)$. Kritikus értéket a Kolmogorov táblázatból nézhetünk.

Függetlenség vizsgálat

Azt vizsgáljuk, hogy az elemzett változók függetlennek tekinthetőek-e. Kapcsolódó próba: χ^2 próba nominális vagy ordinális változókra.

 χ^2 próba (kétdimentiós statisztikai minta) esetén a két mintát külön-külön intervallumokra osztjuk, majd az intervallumokból táblázatot készítünk. Itt is érvényes az 1D-s ökölszabály kiterjeszése: minden kitöltött cellában kb. azonos nagysegrendbe szerepeljenek értékek! A táblázat celláinak értéke θ_{ij} , az adott sorhoz tartozó bekövetkezési valószínűség $p_i = \sum_{j=1}^s p_{ij}$, az oszlophoz $p_j = \sum_{i=1}^r p_{ij}$. A sorok száma r, az oszlopok száma s.

Homogenitás vizsgálat

Azt vizsgáljük, hogy az elemzett változók eloszlása azonos-e, vagyis az eloszlásfüggvények közösek-e. Kapcsolódó próbák: χ^2 próba, kétmintás Kolmogorov-Szmirnov próba, Mann-Whitney próba, Wilcoxon próba, Kruskal-Wallis próba, Friedmann próba.

 χ^2 próba esetén két mintarealizációnk van: X elemszáma n_1 , Y-é n_2 . Az X mintarealizációt r intervallumra osztjuk. Összeszámoljuk, hogy hány minta esett egy-egy intervallumba az X mintarealizációból (θ_i) és mennyi az Y mintarealizációból λ_i . Kritikus értéket a χ^2 táblázatból tudunk nézni.

Kétmintás Kolmogorov-Szmirnov próba esetén feltételezzük, hogy a minták függetlenek különböző eloszlásfüggvénnyel. A homogenitás vizsgálatához a minták empirikus eloszlásfüggvényeinek $(F_{n_1}(x)$ és $(F)_{n_2}(x)$ különbségét vizsgáljuk. Kritikus értéket a Kolmogorov táblázatban találunk.

Mann-Whitney próba esetén az X minta adatait két részre osztjuk egy Y csoportképző változó segítségével, így kapjuk x (elemszáma n) és y (elemszáma m) részmintákat. A két minta összefésüléséból képezzük a $z_1^* \leq z_2^* \leq ... \leq z_{n+m}^*$ rendezett mintát. A rendezett minta elemeihez rangszámokat (r_i) rendelünk: a legkisebb elem rangszáma 1, a legnagyobbé N = n + m. Kritikus értéket a standard normális táblázatból kapjuk.

Kruskal-Wallis próba esetén több független minta együttes homogenitás-vizsgálatát szeretnénk elvégezni. A nullhipotézisünk, hogy a p független minta ugyanabból az eloszlásból származik-e. A p független mintát és Y tördelő változó segítségéven állítjuk elő az X változó eseteiből, vagyis a Y változó értékei p csoportra osztják az X minta eseteit (n_j a csoport elemszáma, N az összes csoport elemszámának összege). Ismét képezzük a rendezett mintát és az alapján az elemeket rangszámokkal látjuk el (R_j). Kritikus értéket a χ^2 táblázatban találunk.

Wilcoxon próba esetén azt ellenőrizzük, hogy az összetartozó mintákból készített adatmátrix X és Y változója azonos eloszlásfüggvényhez tartozik-e. Képezzük az összetartozó adatpárok különbségét (d_i) , vegyük annak előjelét (s_i) és az eltérések abszolút értékét (a_i) . CSináljunk az abszolút eltérésekből rendezett mintát (a_i^*) és ezekhez rendeljünk rangszámot. A pozitív differenciák rangszám-összege R_+ . A kritikus értéket a standard normális táblázatban találjuk $(\Phi(u_{\varepsilon}) = 1 - \frac{\varepsilon}{2})$.

Friedmann próba esetén p változó azonos eloszláshoz tartozását ellenőrizzük. Az adatmátrix minden sorához rangszámokat rendelünk, ahol a rangszám megadja, hogy az adott elem hagyadik legkisebb az adott sorban. $R^{(j)}$ az egyes oszlopokhoz tartozó rangszám-összeg. Kritikus értéket a χ^2 táblázatban találunk, ha kicsi az elemszám.